NAR Labs 國家實驗研究院

台灣半導體研究中心

文件名稱:	設備作業標準(SE-014 破片光阻旋轉塗佈機)
文件編號:	Q3-NL04
制訂部門:	異質整合製程組
制訂日期:	2019-02-15

文件制修訂記錄

版本	編製者	生效日期	核定文號	改版/變更說明	修訂頁次
1.0	湯淵富	2019-02-22	IS108008	制定新版	

NAR Labs 國家實驗研究院 DOCUMENT NO.: TITLE: 台灣半導體研究中心 Q3-NL04 設備作業標準 (SE-014 破片光阻旋轉塗佈機) ISSUE DATE 2019-02-22 REVISION 1.0 PAGE 第 1/3 頁

一、目 的:

定義破片光阻旋轉塗佈機操作規範,以確保操作品質。

二、範 圍:

適用於破片光阻旋轉塗佈機。

三、權 責:

1. 組織權責:工程師負責制定及修改規範。

2. 執行人員資格:經過破片光阻旋轉塗佈機考核通過之人員。

四、名詞定義:

無。

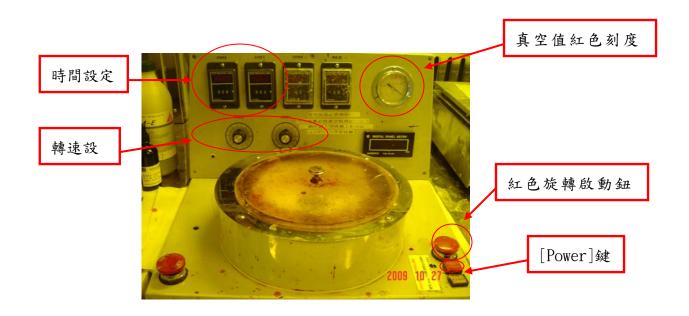
五、 相關文件:

無。

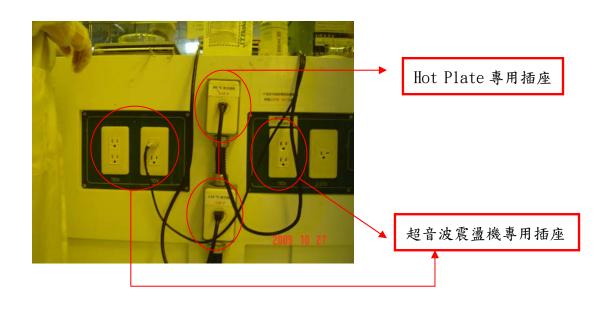
六、標準作業程序:

- 1. 使用前先將 Pump 打開(按壓[Power]鍵),選取適當之吸頭(chuck),確認 wafer 可確實被吸住(觀察真空值可達紅色刻度以下),設定 step1(low)與 step2(high)轉速值(RPM)與時間(秒),按壓右側紅色啟動鈕,並於使用後將 Pump 關閉(按壓[Power]鍵)(如圖一)。
- 2. Hot Plate 請於使用前才加熱,1小時以上不使用請關閉,以延長加熱板壽命,並且勿超過使用溫度上限 200度,不使用時需將插頭拔離。
- 3. 使用旋塗機時為避免污染與有機液體流入腔體內造成無法吸附試片,需於旋塗機內鋪上 無塵擦拭紙並於使用後清理乾淨。
- 4. 使用後請收拾乾淨,使用器具收歸原位,使排風櫥之門關閉。
- 5. 使用中請儘量將排風櫥之門拉下至不影響操作為原則,以減少溶劑揮發到無塵室。
- 6. 超音波震盪機使用時須隔水震盪,液位視盛裝震盪物容器而定,以容器可以穩定不翻 覆為原則。

MARLabs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO.:	TITLE:		
		Q3-NL04	設備作業標準 (SE-014 破片光阻旋轉塗佈機)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 2/3 頁



(圖一)



(圖二)

NAR Labs 國家實驗研究院 DOCUMENT NO.: TITLE: 台灣半導體研究中心 Q3-NL04 設備作業標準 (SE-014 破片光阻旋轉塗佈機) ISSUE DATE 2019-02-22 REVISION 1.0 PAGE 第 3/3 頁

注意事項:

- 1. 使用前須以擦試紙包覆塗佈區,避免光阻或旋塗液弄髒環境。使用後務必須以擦試紙清理乾淨, 並將弄髒區域(包含蓋子、腔體與工作檯面)擦拭乾淨。
- 2. Hot plate 使用前插頭必須於安擦於正確之插座上(依插座上之張貼說明),避免跳電。使用後若接續無人使用則需關閉烤盤電源,以策安全(如圖二)。
- 3. 此機台之水槽排放是接酸鹼廢液管,嚴禁將有機廢液(如:Acetone, IPA, 與光阻顯影液)直接 倒入排放使用,需倒入至廢液回收桶(使用後必須立刻將桶蓋旋緊,避免有機異味飄散),若發現 違反規定者,立即取消使用資格,與進出無塵室之磁卡,並且不再予與重新認證機台之使用。
- 4. 旋塗機更換吸盤(chuck)時, 施力須保持垂直拉拔, 避免不當施力造成支撐桿彎曲變形。另為減少 拉拔次數,使用後毋須將吸盤(chuck)時拔離,留待下位使用者視使用條件決定更換與否。
- 5. 實驗室提供之顯影液(AD-10)適用於 AZ 光阻系列,其為強鹼性、強腐蝕性溶劑並含 2. 38%TMAH(氫氧化四甲基銨),故使用時需配戴好安全防護器具(耐酸鹼手套、護目鏡、有機濾毒罐空氣呼吸器等),保護自身安全。
- 6. [Power]鍵不吸真空時務必解除,避免 pump 不間斷運轉造成損壞!!(如圖一)。
- 7. 使用後將工作檯面整理乾淨,未通過考核嚴禁使用。

七、應用表單及附件:

- 1. Q4-NL02 設備管理卡
- 2. Q4-NL03 設備考核表
- 3. Q4-NL04 設備點檢表
- 4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單